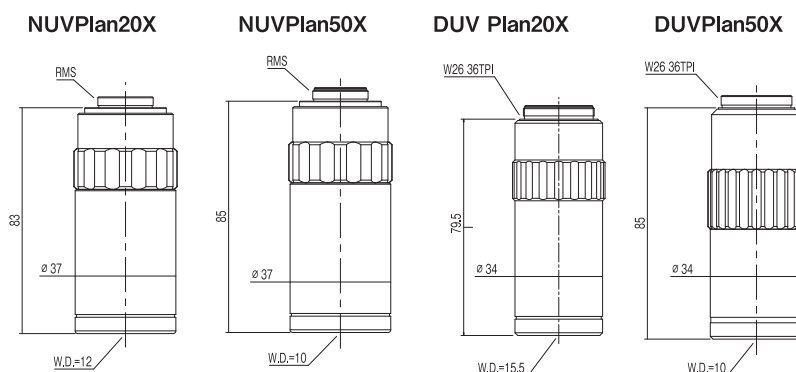


FA用金属顕微鏡・対物レンズ

近紫外対物レンズ

NUV・DUV Planシリーズ

明視野観察用の長作動距離対物レンズです。可視域と近紫外(355/266nm)で使用する波長において、ピントが合うように補正されている対物レンズです。近紫外域の分光透過率を高く設計しており、顕微鏡に取付けてYAGレーザ(355/266nm)を併用することで、半導体回路やLCDのリペアなどの薄膜加工に最適です。



■Specification

Model	NUV PlanAPO 20X	NUV PlanAPO50X	DUV Plan 20X	DUV Plan50X
Magnification	20X	50X	20X	50X
Working Distance	12mm	10mm	15mm	12mm
Focal Distance(f)	10mm	4mm	10mm	4mm
N.A.	0.5	0.5	0.36	0.4
Resolution	0.6 μ m	0.6 μ m	0.93 μ m	0.84 μ m
Focal Depth($\pm$ D.F)	1.1 μ m	1.1 μ m	2.1 μ m	1.7 μ m
Wave Length	345nm-1600nm		266-532nm	
Max allowable laser energy	0.1J/cm ² @532nm PulseWidth10nsec	0.1J/cm ² @532nm PulseWidth10nsec	-	-
	0.047J/cm ² @355nm PulseWidth10nsec	0.028J/cm ² @355nm PulseWidth10nsec	-	-
Glass Correction	-/1.0mm(LCD)	-/1.0mm(LCD)	-	-
Weight	435g	510g	360g	320g

Note: Resolution and Focal Depth calculated using the wavelength of $\lambda = 0.55\mu\text{m}$.

Resolution = $0.61 \times 0.55(\lambda) / \text{NA}$, Focal Depth $\pm D(\mu\text{m}) = 0.55(\lambda) / [2(\text{NA})^2]$

マイケルソン式白色干渉対物レンズ

MIFシリーズ

白色干渉計での使用を目的としたマイケルソン式干渉対物レンズです。合焦位置でサンプル像とともに内蔵するビームスプリッタと参照ミラーによりサンプルの高低差による干渉縞の像が得られます。

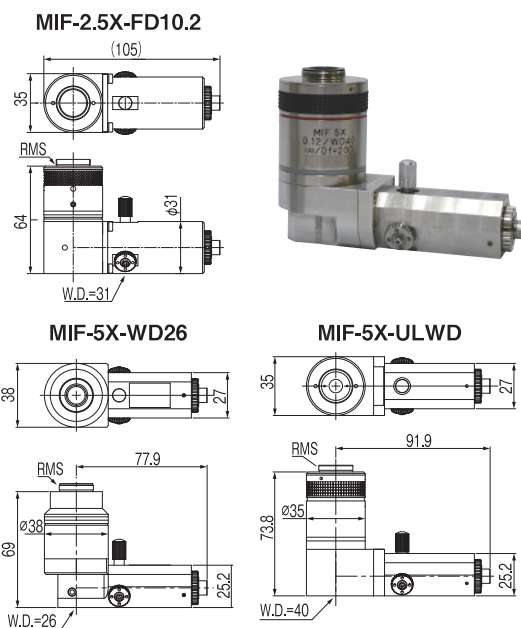
※カスタマイズで製作する受注生産品で、上図は製作例です。シャッターの有無、参照ミラーの調整方法などご相談の上で製作いたします。

■Specification

Model	MIF-2.5X-FD10.2	MIF-5X-WD26	MIF-5X-ULWD
Magnification	2.5X	5X	5X
Working Distance	31mm	26mm	40mm
Focal distance (f)	80mm	40mm	40mm
N.A.	0.1	0.13	0.08
Resolution	3.4 μ m	2.6 μ m	4.2 μ m
Focal depth ($\pm$ D.F)	27.5 μ m	16.3 μ m	42.9 μ m
Wavelength	486-656nm	486-656nm	486-656nm
Reference Mirror Surface Flatness	$\lambda/20$	$\lambda/20$	$\lambda/20$
Parfocal Distance	95mm	95mm	114mm

Note: Resolution and Focal Depth calculated using the wavelength of $\lambda = 0.55\mu\text{m}$.

Resolution = $0.61 \times 0.55(\lambda) / \text{NA}$, Focal Depth $\pm D(\mu\text{m}) = 0.55(\lambda) / [2(\text{NA})^2]$



リニク式干渉対物レンズ

LIFシリーズ

カスタム設計製造しています。お問い合わせください。

